幾何学的フラストレーションを有する希土類化合物における 非従来型の異常ホール効果の検証

神戸大学 大学院理学研究科物理学専攻 松岡英一

Study of the Unconventional Anomalous Hall Effect on the Rare-Earth Compounds with Geometrical Frustration

Eiichi Matsuoka

Department of Physics, Graduate School of Science, Kobe University

次世代の情報記録媒体の動作原理として、結晶構造に幾何学的フラストレーションを有 する反強磁性体が示す非従来型の異常ホール効果(AHE)が注目されている。本研究では、 AHE を示す新しいf電子系化合物の探索を目的として、立方晶の新化合物系である R₆Pd₁₃Zn₄ と R₆Mg₂₃Z(R=希土類、Z=第14,15 族元素)に注目し、AHE の有無を検証した。 これらの化合物系には幾何学的フラストレーションの影響を受けた反強磁性状態を持つも のが多く存在するが、Ce₆Pd₁₃Zn₄、Pr₆Pd₁₃Zn₄、Sm₆Pd₁₃Zn₄、Ce₆Mg₂₃Ge、Pr₆Mg₂₃Ge、 Nd₆Mg₂₃Ge、Ce₆Mg₂₃Si のホール抵抗の磁場依存性を測定した結果、これらの化合物にお いて AHE は観測されなかった。また、AHE を示し得る新化合物の探索を行った結果、立 方晶化合物 CeMgZn₂を見出し、この化合物が幾何学的フラストレーションの影響を強く 受けた反強磁性状態を示すことを明らかにした。CeMgZn₂についてもホール抵抗の磁場依 存性を測定した結果、AHE は観測されなかった。

An unconventional anomalous Hall effect (AHE) exhibited by antiferromagnets with geometrical frustration has been focused on as a novel operating principle of new recording media. In this study, the Hall resistivities of new cubic compounds R₆Pd₁₃Zn₄ and R₆Mg₂₃Z (R: rare earths, Z: group 14 and 15 elements) have been measured and examined if the AHE contributes to Hall resistivities. Although the antiferromagnetic states of these compounds are affected by the geometrical frustration, no contribution of the AHE has been found in the Hall resistivities of Ce₆Pd₁₃Zn₄, Pr₆Pd₁₃Zn₄, Sm₆Pd₁₃Zn₄, Ce₆Mg₂₃Ge, Pr₆Mg₂₃Ge, and Nd₆Mg₂₃Ge. We have searched for new compounds with geometrical frustration and found a new cubic compound CeMgZn₂ whose antiferromagnetic states are strongly affected by the geometrical frustration. No contribution of the AHE has been found in the Hall resistivities of CeMgZn₂.

1. はじめに

近年、次世代の情報記録媒体として、強磁性体の磁化の向きとして情報を記録する磁気 抵抗メモリの開発が進められている。磁気抵抗メモリは省電力かつ高速という利点を持つ が、実用化に向けての問題点もある。その一つは、記録素子の集積度が向上するにつれて、 隣接素子からの漏洩磁場により記録情報が不安定化することである。これを解決する手段 として、自発磁化を有しない反強磁性体を記録素子に用いる可能性が注目され¹⁾、情報の 書き込みと読み取りの原理に関する基礎研究が始まっている。このような中、読み取り原 理となり得る新しい現象として注目されているのが、結晶構造に幾何学的フラストレーシ ョンを有する反強磁性体が示す、非従来型の異常ホール効果(以下、AHE と記す)である²⁾。 自発磁化のない反強磁性体は、一般にゼロ磁場下では磁化に由来するホール効果(従来型 の異常ホール効果)を示さない。しかし、Fig.1のように隣接スピンと120°の角度をなす ことでフラストレーションと折衷した反強磁性構造を取る Mn₃Pt と Mn₃Ir (磁性を担う Mn が正八面体の副格子を組む)の場合は、磁化に由来しない異常ホール効果を示し得る ことが理論的に予測されていた³⁾。これが AHE である。ところが、フラストレーション を有する化合物の多くが d 電子系酸化物(絶縁体)で導電性化合物が少ないため、AHE の 実証例も少数の導電性の d 電子系が中心であり、理論研究との対比も十分ではない。物性 研究における d 電子系とf 電子系の相補性を考慮すると、これまでほとんど例のない導電 性のf 電子系による AHE の検証が、その発現機構の理解に大きく寄与する可能性がある。

そこで本研究では、立方晶の新化合物系である $R_6Pd_{13}Zn_4(R=希土類)$ と、 $R_6Mg_{23}Z(Z=$ 第 14, 15 族元素)に注目した。これらの結晶構造は、Fig.2 に示すように磁性を担う R が 正八面体の副格子をなす点で、Fig.1 の結晶構造と類似する。さらに、 $Ce_6Pd_{13}Zn_4$ や $Ce_6Mg_{23}Ge$ 等が、フラストレーションの影響を強く受けた反強磁性状態を示すことを見 出したため ⁴⁻⁶⁾、本研究では $R_6Pd_{13}Zn_4$ と $R_6Mg_{23}Z$ の RとZを変化させた化合物系を対 象に、AHE の検証実験を行った。



Fig. 1 Crystal and magnetic structures of Mn_3Pt and Mn_3Ir .



Fig. 2 Crystal structures of $R_6 Pd_{13}Zn_4$ (left) and $R_6 Mg_{23}Z$ (right). Only R atoms are shown. Dotted lines represent edges of the chemical unit cells.

2. 実験方法

2.1 多結晶試料の作製

R₆Pd₁₃Zn₄ と R₆Mg₂₃Z は、Zn と Mg という高蒸気圧の金属を含むため、耐圧性容器内 に構成元素を密封した状態で加熱することで試料作製を行う必要がある。本研究では、高 融点、かつ他の元素との反応性が低い金属である Mo、または Ta で作られたるつぼ内に 構成元素を化学当量比(あるいは化学当量比から数%程度増減させた比)で密封し、950℃ ~1200℃の温度で構成元素を融解後、650℃~750℃で一週間程度の熱処理を行うことで多 結晶試料作製が行われた。

 $R_6Pd_{13}Zn_4$ については、R=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb の七化合物が存在することが報告されている⁷⁾。本研究で作製した多結晶試料の粉末 X 線回折実験を行った結果、R の原

子番号が大きくなるにつれて、得られた多結晶試料中の不純物濃度が増加する傾向がある ことが分かった。構成元素の比率や熱処理の温度を最適化することで不純物量を減らすこ とが出来たものの、R=Gd, Tb の二化合物については不純物相を体積割合で1/3以下に 減らすことが出来なかった。また、R=Nd の化合物については不純物をほとんど含まな い試料が得られるものの、物性の試料依存性がかなり大きかった。そこで本研究では、R= La, Ce, Pr, Sm の四化合物を対象として AHE の検証を行った。

 $R_6Mg_{23}Z$ の場合、Z=CについてはR=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gdの化合物が存在し、 Ce₆Mg₂₃ZについてはZ=C, Si, Ge, Sn, Pb, P, As, Sbの化合物が存在することが報告され ている⁸⁾。しかし、本研究で得た多結晶試料の粉末X線回折実験の結果、単相として得ら れるのは、報告された化合物の一部に限られることが分かった。すなわち、Ce₆Mg₂₃Ge、 Pr₆Mg₂₃Ge、Nd₆Mg₂₃Ge、Ce₆Mg₂₃Siの四化合物のみが単相として得られたため、この 四化合物を対象としてAHEの検証を行った。

R₆Pd₁₃Zn₄とR₆Mg₂₃Zに関する研究と並行して、幾何学的フラストレーションを持つ 新しい*f*電子系化合物の探索も行った結果、立方晶化合物CeMgZn₂を見出した。 CeMgZn₂についても上記と同様な作製方法で純良な多結晶試料が得られたため、その基 礎物性の解明を行うと共に、AHEの検証を行った。

2.2 物性測定

電気抵抗率 $\rho = S \cdot V / (L \cdot I) (I: 電流、V: 電流方向に生じる電圧、S: 試料の断面積、L:$ $試料の長さ)と、ホール抵抗<math>\rho_{\rm H} = V_{\rm H} \cdot t / I (I: 電流、V_{\rm H}: 電流と印可磁場の両方に垂直な方向$ $に生じるホール電圧、t: 試料の厚さ)は、直流四端子法で測定された。<math>\rho \ge \rho_{\rm H}$ を測定した 温度Tの範囲は0.4K < T < 300K、磁場Hの範囲は0 < H < 9Tである。磁化Mは Quantum Design 社製の SQUID 磁束計(MPMS)を用いて、1.8K < T < 300Kの温度範囲、 0 < H < 5Tの磁場範囲で測定された。比熱Cは自作の熱緩和法装置を用いて、0.6K < T < 9Kの 温度範囲で測定された。

3. 結果と考察

3.1 Ce₆Pd₁₃Zn₄のホール効果

Fig.3 に Ce₆Pd₁₃Zn₄のホール抵抗 $\rho_{\rm H}$ の磁 場依存性を示す。Ce₆Pd₁₃Zn₄ は $T_{\rm N}$ =3.3K 以下で一部のスピンが常磁性状態に留まる反 強磁性構造を取り、 $T_{\rm N}$ '=1.3K以下で Fig.1 に示した 120°の反強磁性構造を取ると推測 されていた⁴⁾。そのため $\rho_{\rm H}$ の測定は、0.43K ($T < T_{\rm N}$ ')、2.5K($T_{\rm N}$ ' < $T < T_{\rm N}$)、4.2K($T > T_{\rm N}$) の三つの温度で行われた。常磁性状態である 4.2K での $\rho_{\rm H}$ は、磁場の増加に従ってなだ らかに増加する。一方、反強磁性状態での $\rho_{\rm H}$ も磁場によって増加するが、2.5Kの $\rho_{\rm H}$ は 2~3Tの磁場で肩を示し、0.43Kの $\rho_{\rm H}$ は 3T で極大を示す点が4.2Kでの挙動と異なる。



Fig. 3 Magnetic-field dependence of the Hall resistivities $\rho_{\rm H}$ of Ce₆Pd₁₃Zn₄ measured at various temperatures. The $\rho_{\rm H}$ data measured at 0.43 K and 2.5 K are shifted vertically by the values in the parentheses for ease of observation. Solid lines represent the fitted results (see text).

反強磁性状態で見られる肩や極大は正常ホー ル効果によっては説明出来ず、異常ホール効 果(従来型、もしくは非従来型)の存在を示唆 する物である。特に 0.43Kの $\rho_{\rm H}$ に見られる ような極大は、f電子系化合物である UCu₅ でも見られ、その出現が従来型の異常ホール 効果ではなく、AHE に起因すると報告され ている⁹⁾。しかし参考文献 4)で報告された ように、1.8K($T_{\rm N}$ ' < $T < T_{\rm N}$)での磁化 Mの磁 場依存性が 3.5T で折れ曲がりを示すことを 考えると、反強磁性状態で現れた $\rho_{\rm H}$ の肩と 極大は、AHE によって出現したものではな



Fig. 4 Magnetic-field dependence of the electrical resistivities ρ of Ce₆Pd₁₃Zn₄ measured at various temperatures.

く、磁場印可による反強磁性状態から常磁性状態への遷移に対応した磁化の変化、すなわち、従来型の異常ホール効果によって出現したものであると考えられる。このことを定量的に考察するために、 $\rho_{\rm H}=R_0H+R_{\rm s}M$ という式を用いて実験結果のフィッティングを行った。ここで、 R_0 は正常ホール係数、 $R_{\rm s}$ は従来型の異常ホール係数で、 $R_{\rm s}=a\rho+\beta\rho^2(a)$ と身は定数)と表され、 R_0 , a, β がフィッティングパラメーターである。また、磁化 Mとしては参考文献 4)で報告されたデータを用い、 $R_{\rm s}$ の表式中に現れる電気抵抗率 ρ としては、Fig.4に示したデータを用いた。Fig.3に青の実線で示したのが 2.5K でのフィッティング結果であり、2~3T の肩が再現されている。また、赤の実線は 0.43K でのフィッティング結果であり、3T の極大が再現されている。

3.2 その他のR₆Pd₁₃Zn₄のホール効果

本研究で作製した $Pr_6Pd_{13}Zn_4$ は、0.4K以 上で磁気転移を示さなかった。これは参考文 献 6) での報告と同じ結果である。つまり 0.4K以上では AHE の出現は期待出来ない。 実際に、 $Pr_6Pd_{13}Zn_4$ のホール抵抗 ρ_H は、最 低の測定温度である 0.5Kにおいても、Fig.5 に示すように磁場印可によって直線的に増加 するのみであった。一方、 $Sm_6Pd_{13}Zn_4$ は、 26K と 7.5K で強磁性的な相転移を示し、 3.5K で反強磁性的な相転移を示すことが分 かったため、3.5K以下では AHE が出現しう る状況にある。しかし、常磁性状態と磁気秩





序状態とで $\rho_{\rm H}$ にほとんど差が見られず、最低の測定温度である 0.5Kにおいても、Fig.5 に示すように $\rho_{\rm H}$ は磁場印可によって直線的に増加するのみであった。従って、 Sm₆Pd₁₃Zn₄の $\rho_{\rm H}$ に対しても AHE の寄与は見られないと言える。

3.3 R₆Mg₂₃Zのホール効果

Ce₆Mg₂₃Ge と Ce₆Mg₂₃Si は、それぞれ 1.6K と 1.2K で反強磁性転移を示すことが報告

されている⁵⁾。また、Pr₆Mg₂₃GeとNd₆Mg₂₃Geは、 それぞれ 6.4Kと 12.5Kで反強磁性転移を示すこ とを本研究で明らかにした。Fig.6 にこれら四化 合物の反強磁性状態におけるホール抵抗 $\rho_{\rm H}$ の磁 場依存性を示す。四化合物とも、常磁性状態での $\rho_{\rm H}$ が磁場の増加に従って直線的に減少するのに 対し、Fig.6 に示した反強磁性状態での Ce₆Mg₂₃Ge、Pr₆Mg₂₃Ge、Ce₆Mg₂₃Siの $\rho_{\rm H}$ は、 それぞれ 1.7T、2.7T、2.6T付近を中心とした肩 を示す。このような肩の出現は、上述した Ce₆Pd₁₃Zn₄の場合と同様に、AHE によるもので はなく、磁場印可による反強磁性状態から常磁性 状態への遷移に対応した磁化の変化、すなわち、 従来型の異常ホール効果によって説明可能であ る。一方、Nd₆Mg₂₃Geの $\rho_{\rm H}$ は肩を示すことなく、



Fig. 6 Magnetic-field dependence of the Hall resistivities $\rho_{\rm H}$ of Ce₆Mg₂₃Ge, Pr₆Mg₂₃Ge, Nd₆Mg₂₃Ge, and Ce₆Mg₂₃Si measured at 0.5 K. The $\rho_{\rm H}$ data of Ce₆Mg₂₃Ge, Pr₆Mg₂₃Ge, and Ce₆Mg₂₃Si are shifted vertically by the values in the parentheses for ease of observation.

磁場の増加に伴ってなだらかに減少している。Nd₆Mg₂₃Geのρ_Hが肩や極大を示さないの は、AHEの寄与が見られないことに加えて、反強磁性状態から常磁性状態へ遷移する磁場 が9Tよりも大きく、従来型の異常ホール効果の変化も見られないためであると考えられる。

3.4 CeMgZn₂のホール効果

Fig.1のような 120°の反強磁性構造を示し得る 新化合物の探索を行った結果、Fig.7 に示すよう に、磁性を担う Ce を頂点とする正四面体が一辺 を共有して並んだ構造を持つ立方晶化合物 CeMgZn₂を見出した。そして、CeMgZn₂が $T_{N1}=5.4$ Kと $T_{N2}=3.1$ Kで反強磁性転移を示し、 3T以下の磁場下で少なくとも四つの磁気秩序相 を持つことを明らかにした。立方晶化合物にもか かわらずこのような複雑な磁気秩序状態を示すこ とは、幾何学的フラストレーションの強い影響が 存在することを示唆する。これらの CeMgZn₂の 基礎物性は、参考文献¹⁰⁾で報告されている。

以上の結果を踏まえて、CeMgZn₂のホール抵 抗 $\rho_{\rm H}$ の測定を行った。Fig.8に、6.5K($T > T_{\rm N1}$)、 4.3K($T_{\rm N2} < T < T_{\rm N1}$)、0.5K($T < T_{\rm N2}$)の三つの温度 で測定した CeMgZn₂のホール抵抗 $\rho_{\rm H}$ の磁場依 存性を示す。いずれの温度においても、 $\rho_{\rm H}$ は磁 場の増加に従ってなだらかに減少し、反強磁性状 態(4.3K ≥ 0.5 K)においても Ce₆Pd₁₃Zn₄の場合 に現れたような肩や極大を示さなかった。このよ うな単調な $\rho_{\rm H}$ の磁場変化は、正常ホール効果と



Fig. 7 Crystal structure of $CeMgZn_2$.



Fig. 8 Magnetic-field dependence of the Hall resistivities $\rho_{\rm H}$ of CeMgZn₂ measured at various temperatures.

従来型の異常ホール効果を考慮するだけで説明可能と考えられる。すなわち、CeMgZn₂ の $\rho_{\rm H}$ にも AHE の寄与は見られない。

4. 結論

本研究では、幾何学的フラストレーションを有する立方晶の新化合物系である R₆Pd₁₃Zn₄とR₆Mg₂₃Zに注目し、磁化に由来しない非従来型の異常ホール効果(AHE)の 有無を検証した。これらの化合物系は、Fig.1に示した120°の反強磁性構造を示す可能性 があり、その場合にはAHEを示し得ることが期待されたものの、Ce₆Pd₁₃Zn₄、 Pr₆Pd₁₃Zn₄、Sm₆Pd₁₃Zn₄、Ce₆Mg₂₃Ge、Pr₆Mg₂₃Ge、Nd₆Mg₂₃Ge、Ce₆Mg₂₃Siのホー ル抵抗の磁場依存性を9T以下で測定した結果、これらの化合物においてAHEは観測さ れなかった。また、120°の反強磁性構造を示し得る新化合物の探索を行った結果、Ce を 頂点とする正四面体が一辺を共有して並んだ構造を持つ立方晶化合物 CeMgZn₂を見出し、 この化合物が幾何学的フラストレーションの影響を強く受けた反強磁性状態を示すことを 明らかにした。CeMgZn₂についてもホール抵抗の磁場依存性を9T以下で測定した結果、 AHE は観測されなかった。

5. 謝辞

本研究は、2019年度日本板硝子材料工学助成会の研究助成を受けて行われた。同助成会 に心より感謝を申し上げる。

6. 参考文献

- 1) A. H. MacDonald and M. Tsoi, Phil. Trans. R. Soc. A 369, 3098 (2011).
- 2) S. Nakatsuji, and N. Kiyohara, T. Higo, Nature **527**, 212 (2015).
- 3) H. Chen, Q. Niu, and A. H. MacDonald, Phys. Rev. Lett. **112**, 017205 (2014).
- 4) E. Matsuoka, A. Oshima, H. Sugawara, T. Sakurai, and H. Ohta, J. Phys. Soc. Jpn. 87, 013705 (2018).
- 5) R. Shibuya, E. Matsuoka, H. Sugawara, T. Sakurai, and H. Ohta, JPS Conf. Proc. **30**, 011109 (2020).
- 6) E. Matsuoka, Y. Iwakiri, A. Oshima, H. Sugawara, T. Sakurai, and H. Ohta, JPS Conf. Proc. **30**, 011110 (2020).
- 7) B. Gerke, O. Janka, and R. Pöttgen, Z. Anorg. Allg. Chem. **640**, 2747 (2014).
- 8) F. Wrubl, P. Manfrinetti, M. Pani, P. Solokha, and A. Saccone, Inorg. Chem. **55**, 191 (2016).
- B. G. Ueland, C. F. Miclea, Y. Kato, O. Ayala–Valenzuela, R. D. McDonald, R. Okazaki, P. H. Tobash, M. A. Torrez, F. Ronning, R. Movshovich, Z. Fisk, E. D. Bauer, I. Martin, and J. D. Thompson, Nature Commun. 3, 1067 (2012).
- 10) E. Matsuoka, T. Yoshimoto, H. Sugawara, T. Sakurai, and H. Ohta, J. Phys.: Conf. Ser. **2164**, 012035 (2022).